実験報告書様式(一般利用課題·成果公開利用)

MLF Experimental Report	提出日 Date of Report
課題番号 Project No.	装置責任者 Name of responsible person
2012PX0003	田中伊知朗
実験課題名 Title of experiment	装置名 Name of Instrument/(BL No.)
電子・原子レベルから眺めた高機能性高分子の	iBIX (BL-03)
構造物性相関解明:広角中性子回折測定に基づく挑戦	実施日 Date of Experiments
実験責任者名 Name of principal investigator	2012年6月12日~14日
田代孝二	2013 年3月21日~24日
所属 Affiliation	
豊田工業大学大学院工学研究科極限材料専攻	

試料、実験方法、利用の結果得られた主なデータ、考察、結論等を、記述して下さい。(適宜、図表添付のこと) Please report your samples, experimental method and results, discussion and conclusions. Please add figures and tables for better explanation.

1.	試料 Name of sample(s) and chemical formula, or compositions including physical form.
	重水素化ポリエチレン -(CD2CD2)- 一軸延伸試料
	重水素化ポリオキシメチレン-(CD $_2$ 0)- γ 線固相重合試料(多結晶体)
	ジアセチレンポリマー単結晶 - (C4 (NC7H8)2)-

2. 実験方法及び結果(実験がうまくいかなかった場合、その理由を記述してください。)

Experimental method and results. If you failed to conduct experiment as planned, please describe reasons.

高分子は今や単なる構造材料としてではなく、電気・電子物性や光学的性質まで様々の高機能性を有する 素材として注目されている。これらの物性・機能は原子レベル、電子レベルにまで遡って深く構造の観点か ら理解する必要があるが、実際に試された例はほとんど皆無である。例えば、数多くの高分子は主鎖周りに 水素原子を沢山保有しており、隣接分子鎖の間の水素原子間相互作用が弾性率異方性を初めとする様々の物 性の異方性決定に大きく寄与している。しかし、この大事な水素原子の位置を精確に決定できた高分子の例 は極めて限られている (K. Tashiro et al., Macromolecules (20004), Polymer Journal (2007), Macromolecules(2011))。また、電気伝導性高分子材料など電子共役系高分子の構造を電子密度分布の観点 から眺めた例も、我々がかつてポリジアセチレンについて成功したケース以外にはない(高分子学会討論会, 57,735(2008))。このように高分子材料の構造物性相関を水素原子さらには電子レベルにまで突っ込んで構 造の立場から詳細に検討していかねばならない。これらの課題へのアプローチには、X 線回折と中性子回折 との有機的組み合わせが極めて有効であるが、高分子結晶構造解析を両者の有機的組み合わせで行った例は これまで皆無であった。申請者らは、様々の合成高分子について広角中性子回折測定を行い、水素原子位置 決定や X-N 法による結合電子密度分布の評価に成功してきた。しかし中性子散乱強度が必ずしも十分ではな く、構造解析も、十分精度の高いものにはなっていないケースもあった。本研究は、これらの試料について J-PARC の強力な中性子線源を利用した広角中性子回折実験に初めて挑戦したものであり、これまでに行っ てきた BIX-3 を用いたデータと比較した。TOF 測定は、一軸配向した高分子試料については初めての試みで ある。また、共役系巨大高分子単結晶における結合電子密度分布の高精度決定にも挑戦した。

2. 実験方法及び結果(つづき) Experimental method and results (continued)

[1] 一軸延伸重水素化ポリエチレン(PE)

ー軸配向した PE 試料のセッティングを図1のように行った。延伸 軸方向を水平にセットし、ビームに対する角度 ω を一定間隔毎に変 化させ、各 ω 毎に中性子回折データを TOF 法で測定した。実際には、 ω =52.5, 57.75, 84.0, 89.25, 115.5, 122.75°にとり、第1 セッ ティングでは、面間隔 0.7~4Åの範囲で、それぞれ露光時間は 2 時 間半、第2セッティングでは、面間隔 4~8Åの範囲で、それぞれ露 光時間は 0.2 時間であった。検出器 A~D の位置と層線(*hk1*)との関 係を図 2(a)に示す。各検出器には異なるタイミングで入ってきた 2 次元パターン(*x*, *y*)が時間軸 *t*に沿って保存されているが、その全て のデータを加工して(*x*, *t*)面に投影したものが図2(b)である。この 場合、時間 t 軸が逆格子空間における一定軸になっている。例えば 赤道線(*hk0*の回折点は全て検出器Dによって集められ、図2(a)の直



Figure 1. Setting of an uniaxially-oriented polymer sample on a goniometer head.



Figure 2 (a) Ewald spheres, detectors A - D, and the reciprocal lattice of the uniaxially-oriented polymer sample (see Figure 1), (b) the *x*-*t* patterns measured with the detectors A - D.

線 PQ

に沿って得られた回折図形が(b)のDパターンであ る。各検出器の異なるωのデータを逆格子空間座 標について並べ直したものが図3であり、それら を組み合わせたものが図4(a)である。(b)はJRR-3 号炉のBIX3装置を用いて測定した同一試料の広角 中性子回折図形である。第1層線までが測定され ており、このデータの解析から重水素原子位置を

見いだした。今回の TOF 法で求めた回 折データは第4層線まで検出できてお り、さらに精度の高い解析が出来ると 期待している。現在、定量解析の方法 を考案中である。

重水素化ポリオキシメチレン多結晶 体についても同様の測定データが得ら <u>わたが 詳細け ニニでは劣略する</u>







[2] ポリジアセチレン単結晶 (PDCHD)

図5のように、このポリマーはジアセチレンモノマーの単結晶に γ線を照射して得られる巨大高分子単結晶である。側鎖として大き なカリバゾリル基を有する。既にX線構造解析はなされているが、 電子密度分布などの詳細を知るためには、中性子回折で原子殻の位 置を知り、X線解析で求めた電子密度分布と組み合わせて、いわゆ る X-N 法を適用することが必要である。既に我々は JRR-3 の BIX3 システムを用いて、予備的に X-N 法を試みた。結果は上々で三重結 合や二重結合などの結合と電子密度分布との関連が明瞭になった。 今回は、iBIX システムを用いて、より精度の高い中性子構造解析を 実行し、電子密度分布の議論をさらに詳しく行うことを目指した。 試料は図6に示すように、長さ2ミリ程度の大きな単結晶である。 ゴニオヘッドにセットし、様々の方向で TOF-WAND データを集めた。 約 48 時間をかけて、およそ1万個の回折点を集めた。データ処理

ゴニオヘッドにセットし、様々の方向で TOF-WAND 約 48 時間をかけて、およそ 1 万個の回折点を集め を行い、1871 個の独立な反射につ いて構造解析を行った。R 因子は 14.8%と必ずしも低くはないが、 BIX3 で行った解析とほとんど同レ ベルのデータおよび構造が得られ た。ただし、この試料は必ずしも 良質ではなく一部の回折点が二つ に割れたりしており、今後、さら に良質の試料で実験を行う予定で ある。また、カリバゾリル基の代 わりに主鎖骨格にベンゼン環が直 接結合した「全電子共役系」ポリ ジアセチレンを用いることで、主 鎖と側鎖の間の電子共役について

Figure 7. Molecular chain structure obtained by the analysis of TOF-WAND data measured for PDCHD single crystal.

る。



Figure 5. Polydiacetylene single crystal obtained by γ -ray-induced solid-state polymerization reaction of monomer crystal.



Figure 6. Computer displays showing the TOF-WAND data taken for PDCHD single crystal.

		iBIX	BIX-3
	liffrn_reflns_number	9992	5958
1.2. C	liffrn_reflns_av_R_equivalents	0.334	0.0455
12	liffrn_reflns_av_sigmal/netl	0.167	0.0429
	liffrn reflns limit h min	-15	-15
	liffrn_reflns_limit_h_max	15	19
	liffrn reflns limit k min	-5	-5
/	liffrn_refins_limit_k_max	5	
	liffrn refins limit I min	-21	-20
	liffrn reflns limit I max	21	2
	efins number total	1871	182
	efins_number_gt	1089	165
3199	efine Is R factor all	0.1475	0.123
	efine Is R factor gt	0.0681	0.114
7	efine Is wR factor ref	0.1644	0.275
	efine Is wR factor gt	0.1369	0.2702
r	efine Is goodness of fit ref	1.043	1.236
T	efine Is restrained S all	1.043	1.230

d > 0.82, λ > 0.6